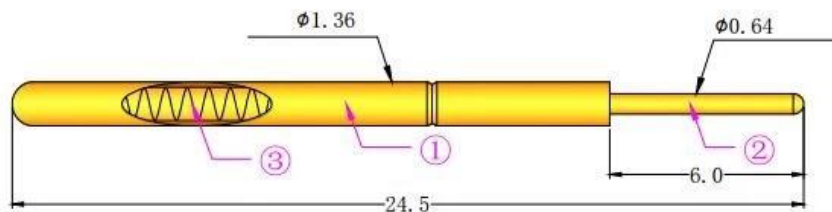


заказной измерительный щуп SF-PA160-J диаметром 0,64 мм

Изображение продукта





Materials (Plated) (材質與鍍層) :

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Au on Ni Plated
- ③ Spring (彈弓) : SUS304 (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求) :

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 4.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 200+50gf@ Load 4.0mm

Наш сервис

1. Мы можем ответить на ваш запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем быстро и точно доставить булавки для наших клиентов по всему миру.
4. Мы можем предоставить нашим клиентам самые низкие цены на продукцию высокого качества.

Основные продукты

Подпружиненный штифт (одиночный) для тестирования печатных плат, ICT, FCT и т. Д. ;

Рого-контакт (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, определения местоположения, аккумулятора, полупроводника и усилителя;
Взаимосвязанные приложения;

Двусторонний зонд для испытаний BGA и Semiconductor;

Универсальный штифт без пружины, штифт для нанесения покрытия, штифт LM с сериями QZ и VZ;

Сильноточный зонд, Переключающий зонд, Емкостная игла;

Терминал & розетка / розетка;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК провод, джиг замки, ПОМ, железный шарнир и т. Д.

Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Изображение упаковки

